

## 老化测试系统 | 单温区

## C4-005

## 用途：部品通电老化实验。

- 与顾客部品组合成为完整的测试系统。
- 单温区控制。
- 易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 拥有自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。

## 规格

品名	老化测试系统 C4-005
方式	强制送风循环
使用温度范围	室温+10~260℃
温度调节精度	±1℃ (at210℃)
温度分布精度	±2.5℃ (at210℃)
运行功能	定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行
附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能
内尺寸	W600×D500×H1000mm
电源	单相 AC220V

半导体  
电子 1

电池 2

平板  
显示器 3

其它 4

## 老化测试系统 | 多温区

## C4-006

## 用途：部品通电老化实验。

- 与顾客部品组合成为完整的测试系统。
- 多温区控制。
- 易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 拥有自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。

## 规格

品名	老化测试系统 C4-006
方式	强制送风循环
使用温度范围	室温+10~100℃
温度调节精度	±1℃ (at100℃)
温度分布精度	±2.5℃ (at100℃)
运行功能	定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行
附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能
内尺寸	各温区W710×D460×H140mm
电源	单相 AC220V

